# 固物 2011 期中

## Deschain

## 2022年5月1日

注:以上题目除特别指出外,温度为300K。

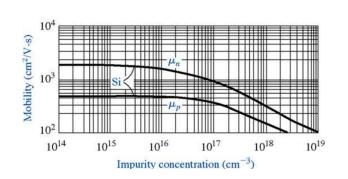
#### 1 一、常用常数

玻尔兹曼常数  $k_B=1.38\times 10^{-23}J/K$ ; 普朗克常数  $\hbar=2.05\times 10^{-34}$ ; 自由电子质量  $m_0=0.91\times 10^{-30}$ ; 真空介电常数  $\varepsilon_0=8.85\times 10^{-14}F/cm$ ; 基本电荷电量  $q=1.6\times 10^{-19}$ 

## 二、材料参数

## Si 材料:

带隙宽度  $E_g=1.12eV$ ,本征载流子浓度  $n_i=1.5\times 10^{10}$ 



<b>一</b> 、	填空题
_,	吳工咫

$\alpha_i$ 由完全相同的一种原子构成的格子,格子中只有一个原子,称为。满足 $\vec{a_i} \cdot \vec{b_j} = 2\pi \delta_{ij} = 0$	
$(2\pi  (i=j)$	
。	
. 对于固体的能带,简约波矢 k 的取值范围要求在	
<b>勺总数。</b>	
. 对于金属的能带,除填满电子的一系列能带后,还有部分被填充的能带,后者称为; 对于半导	
本材料的能带,最高填充的能带称为,其上最低的空带称为。	
. 如果一些能量区域中,波动方程不存在具有布洛赫函数形式的解,这些能量区域称为;能带的	
長示有、、、三种图景。	
. 电子在三维周期性晶格中波函数的方程的解具有的形式,式中	在
晶格平移下保持不变(具有平移对称)。	
. 对于 4 族元素 Si, 5 族元素 P 作为杂质, 1 个 P 原子将可提供 1 个 , 属于 ; 主杂质, 3 族	

元素 B 作为杂质, 1 个 B 原子将提供	<b>共 1 个,属于</b>	_主杂质。	
7. 能带顶部电子的有效质量为(	填写正,或负);能带底部	部电子的有效质量为	_ (填写正,或负)。
8. 温度升高,金属的导电率,	半导体的导电率。	对于金属,温度越高,	金属中的晶格振动
对电子的散射作用,而在半导	体中则是有更多的电子从	人 激发到	<b>†</b> 。

## 二、简述题

- 1. 根据能带理论简述金属、半导体和绝缘体的导电性;并解释为什么半导体掺杂可以提高其导电能力?
- 2. 简述如何利用近自由电子近似模型得到能带图。

## 三、计算题

- 1. 一价金属具有体心立方结构, 晶格常数 a 为 Å, 试求费米面的半径和费米能量。
- 2. 有一补偿型非本征硅半导体,施主和受主杂质浓度均为  $2.5 \times 10^{-17} cm^{-3}$ ,试计算该材料的电导率。

#### 一、填空题答案

1.①布拉菲格子 ②倒格子 ③复式格子 ④两个

2.①第一布里渊区 ②原胞

3.①导带 ②价带 ③导带

4.①禁带 ②简约布里渊区图景 ③周期布里渊区图景 ②扩展布里渊区图景

 $5.0\psi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R_n}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R_n}}u_{\vec{k}}(\vec{r}) \qquad @u_{\vec{k}}(\vec{r})$ 

6.①电子 ②施 ③空穴 ④受

7.①负 ②正

8.①减小 ②增大 ③越大 ④导带 ⑤价带

#### 二、简述题答案

1.①金属: 价带完全填充,导带部分填充,导带中的电子导电。

②绝缘体: 价带完全填充, 导带是空带, 都不能导电。带隙宽, 价带中的电子很难被激发到导带上。

③半导体:价带完全填充,导带是空带,但是带隙较窄。室温下,价带的一部分电子可以热激发到导带上,导带和价带都变成部分填充,可以导电。

④掺杂:杂质分为施主和受主。施主能级位于带隙中接近导带的位置,其电子在室温下可以被激发到导带中;受主能级位于带隙中接近价带的位置,价带电子在室温下可以被激发到受主能级上。因此,杂质可以改善半导体的导电性能。

2. 使用自由电子的波函数和周期势场的平均值  $\overline{V}$  作为零级近似,周期势场的起伏量  $DeltaV = V - \overline{V}$  作为微扰。在布里渊区边界,能级是简并的,使用简并微扰处理,能级劈裂成两个,即能带之间的带隙。

## 三、计算题

1. 设近自由电子浓度为 n, 费米球半径为  $k_F$ , 费米能量为  $E_F$ , 则

$$n = \frac{2}{a^3} = \frac{2}{(3 \times 10^{-10})^3} = 7.4 \times 10^{28} m^{-3}$$
$$k_F = (3\pi n)^{\frac{1}{3}} = 1.3 \times 10^{10} m^{-1}$$
$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m_0} = 1.02 \times 10^{-18} J = 6.4 eV$$

2. 对于完全补偿半导体,载流子浓度为本证载流子浓度,电子和空穴浓度相同, $n=5\times 10^{17}cm^{-3}$ ,杂志总浓度为  $5\times 10^{17}cm^{-3}$ 。电子迁移率为  $400cm^2/v\cdot s$ ,空穴迁移率为  $190cm^2/v\cdot s$ 。 $\mu_n=400cm^{-3}/v\cdot cm^{-1}/s$ ,  $\mu_p=178cm^{-3}/v\cdot cm^{-1}/s$ ,  $n_i=1.5\times 10^{10}cm^{-3}$ 。电导率为  $\sigma=en_i(\mu_n+\mu_p)=1.4\times 10^{-6}(\Omega cm)$